# 基于泰伯莫尔法的长焦距测量系统的装调技术

陆 衡1,陈 好1,何 勇1,李建欣1,胡绍云2,张 浩2,孟庆安2

(1. 南京理工大学 电子工程与光电技术学院,江苏 南京 210094;2. 西南技术物理研究所,四川 成都 610014)

摘 要:为了实现长焦距的精确测量,基于泰伯莫尔法测量长焦距的原理,构建出了由准直波前发生器、泰伯干涉仪和成像采集系统组成的长焦距测量装置。分析了准直波前畸变对焦距测量精度的影响,用数值分析的方法分析了待测样品到光栅 G1 的距离 s,光栅 G1、G2 的间距 d 以及栅线夹角 θ 对焦距测量精度的影响。提出了具体的装调方法:用五棱镜法检测波前,保证准直波前质量 PV 值优于一个波长;用光栅尺位移传感器测量 s,标定 d,使其精度达到 0.1mm;采用标准反射凹球面法标定光栅夹角,使光栅夹角的装调精度达到 0.001°。对焦距为 5436 mm 的透镜进行实验测量,误差小于 0.35%。
关键词: Talbot-Moiré 效应; 长焦距测量; 精度分析; 装调
中图分类号: O439 文献标志码: A 文章编号: 1007-2276(2013)10-2836-06

# Alignment method for measurement of long focal length based on Talbot-Moiré effect

Lu Heng<sup>1</sup>, Chen Hao<sup>1</sup>, He Yong<sup>1</sup>, Li Jianxin<sup>1</sup>, Hu Shaoyun<sup>2</sup>, Zhang Hao<sup>2</sup>, Meng Qing'an<sup>2</sup>

 Institute of Electronic Engineering and Optoelectronic Technology, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China; 2. Southwest Institute of Technical Physics, Chengdu 610041, China)

Abstract: In order to achieve high -accuracy measurement of the long focal length, a method of measuring long focal length based on Talbot-Moiré effect was studied in this paper, a long focal length test device was established, it included a collimated wavefront generator, a Talbot interferometer and a imaging system. The effect of wavefront aberration on accuracy of focal length was analyzed. Then the distance s from the sample to the grating G1, the space d between grating G1 and grating G2, and angle  $\theta$  of two grating lines as influencing factors on accuracy of focal length were analysed. The alignment method to improve the accuracy was proposed. Pentaprism method for the detection of wavefront was introduced, to ensure that the collimated wavefront quality better than a wavelength. The linear grating encoder was used to measure s and calibrate d, to make the accuracy of the distance better than 0.1 mm. A reference reflective concave sphere was used for angle calibration, to make the accuracy of angle better than 0.001°. The experimental results show that the relative error is less than 0.35% when measured focal length is 5436 mm.

Key words: Talbot-Moiré effect; long focal length measurement; accuracy analysis; alignment

收稿日期:2013-02-10; 修订日期:2013-03-25

基金项目:十二五国防基础科研项目

作者简介:陆衡(1989-),男,硕士生,主要从事光学测试原理及技术方面的研究。Email:Ihchange@sina.com

导师简介:何勇(1966-),男,研究员,主要从事光学测试原理及技术方面的研究。Email:heyong@njust.edu.cn

## 0 引 言

近年来,国内外激光核聚变,大口径天文望远系 统和空间遥感相机等技术发展迅速,所以对长焦距 系统的测量方法提出了更高的要求, 传统的测量方 法包括放大率法、精密测角法、傅里叶频谱法等,因 其空间局限性很难满足长焦距的测量<sup>[1]</sup>。基于泰伯 莫尔条纹技术测长焦距具有可测量焦距范围广、精 度高、测量光路短、装置简单等特点,因而被广泛研 究。浙江大学侯昌伦提出了用泰伯莫尔法测量长焦 距,并进行了理论上的详细讨论[2];吴玲玲等分析了 泰伯莫尔法测量焦距的极限精度<sup>[3]</sup>;云宇等提出了 基于泰伯效应检测光束准直性[4];王明佳等提出了 精确识别莫尔条纹方向的方法。。焦距测量系统的 装调关系到整个系统能否正常工作和焦距测量的精 确度,因此测量系统装调技术的研究是长焦距测量 的重要组成部分,但是还没有提出具体的装调方法。 文中构建了由准直波前发生器、泰伯干涉仪和成像 采集系统组成的长焦距测试装置,详细分析了被测 样品到光栅 G1 的距离 s, 光栅 G1、G2 的间距 d 以 及栅线夹角 θ 对焦距测量精度的影响,提出了测试 装置关键部件的装调和标定方法,并利用构建的系 统进行了实验验证。

#### 1 测量原理及系统结构

文中采用泰伯莫尔法测量长焦距,系统结构如 图 1 所示,主要包括准直波前发生器、泰伯干涉仪、 成像采集系统。准直波前发生器包括激光器、扩束准 直系统,可以发出准直平行光;泰伯干涉仪包括 Ronchi 光栅 G1 和光栅 G2、接收屏,用来形成莫尔条



Fig.1 System structure

纹;成像采集系统包括成像物镜、CCD相机,用来采 集条纹。

准直波前发生器和 G1 之间的距离适中,保证待 测样品能够方便地放入和取出,激光器的输出功率 大小以在 CCD 靶面上所获得稳定的、正弦性和对比 度好的莫尔条纹为准。G1 和 G2 平行放置且两光栅 的栅线之间存在很小的角度。平行光入射时,在距离 G1 右侧某一个确定泰伯距离处,将存在一个和原光 栅栅线方向相同的泰伯像,G2 放于此泰伯像处,与 泰伯像叠加在接收屏上形成莫尔条纹。不同焦距的 待测样品放入准直波前发生器和泰伯干涉仪之间, 入射平面波则变成球面波,使得泰伯像周期发生变 化,所以接收屏上的莫尔条纹角度也发生变化,通过 傅里叶变换法得到莫尔条纹频谱图,由频谱图可以 得到莫尔条纹偏转角度 φ,根据得到的 φ 角计算出 待测样品的焦距。计算公式为:

$$f = s + \frac{d}{1 - \cos\theta + \sin\theta \tan\varphi}$$
(1)

式中:s 是待测样品与光栅的距离;d 为光栅间距; $\theta$  为光栅 G1、G2 的栅线夹角; $\varphi$  为条纹的偏转角。

# 2 系统的精度分析及几何参数设置

假设准直波前发生器发出的不是严格平行光,则存在准直波前畸变,影响焦距f测量精度;影响公式(1)中焦距测量精度的因素主要包括:系统参数s, d,φ的测量精度和θ角的标定精度。用几何方法分 析波前畸变对测量精度的影响;用数值分析的方法 讨论系统参数对测量精度的影响。

#### 2.1 准直波前畸变

假设由于准直波前畸变,准直波前发生器发出的是球面波,由图2所示的波前与焦距的关系,准直 波前畸变的等价焦距为:



Fig.2 Relation between wavefront and focal length

图中, $\Delta$ h是扩束准直系统波前畸变的 PV 值, $\phi$  为出射波前口径。

待测样品的焦距为 f,结合组合焦距公式可得到:

$$f_{c} = \frac{ff_{e}}{f + f_{e}}$$
(3)

得到准直波前畸变引起的误差为:

$$\frac{\Delta f_e}{f} = \frac{f_c - f}{f} = 1 - \frac{\phi^2}{\phi^2 + 8\Delta hf}$$
(4)

在出射波前口径为  $\phi$ 200 mm,波长为 632.8 nm 的条件下,图 3 为待测样品焦距不同时, $\Delta h = \lambda$ 引起的误差曲线,被测系统焦距为 10 m 时的误 差<0.15%,对测量结果影响比较很小。所以当波 前畸变  $\Delta h < \lambda$  时,符合测量系统的要求。



图 3 待测样品焦距不同时,  $\Delta h = \lambda$  引起的误差 Fig.3  $\Delta h = \lambda$ , error caused by samples of different focal lengths

#### 2.2 系统几何参数分析与设置

待测样品的焦距测量精度由各参数 s,d,θ和 φ 决定。为了达到更高的测量精度,上述的四个参数必 须精确的测量和标定。因此分析了这几个参数引起 的误差,并提出精确的测量方法和标定方法。

在数值分析中,输入量 x 的微小误差导致输出 量 y(x)的少量变化,则说明这个问题是良置的,反之 则是非良置的。如果输入量 x 的干扰量为  $\Delta x = x - x^{*}$ , 则 x 和 y(x)的相对误差分别为  $\Delta x/x$  和  $\frac{y(x) - y(x^{*})}{y(x)}$ 。 条件数可以表示为:

$$c = \left| \frac{y(x) - y(x^{*})}{y(x)} \right| / \left| \frac{\Delta x}{x} \right| \approx \left| \frac{x}{y(x)} \frac{\partial y(x)}{\partial x} \right|$$
(5)

条件数 c 表示输入量 x 的误差对 y(x)的影响程度,c 的值越大,影响程度越大。如果公式(1)中的参数 s,d, $\theta, \varphi$ 的条件数比较大,说明这个参数引起的问题是非良置的,需要精确地测量或者标定。各个量

的误差传递系数可以通过求微分得到,分别为:

$$\left| \begin{array}{l} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{s}} = 1 \\ \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{d}} = \frac{1}{1 - \cos\theta + \sin\theta \tan\varphi} \\ \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \theta} = \frac{-\mathbf{d}(\sin\theta + \cos\theta \tan\varphi)}{(1 - \cos\theta + \sin\theta \tan\varphi)^2} \\ \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \varphi} = \frac{-\mathbf{d}\sin\theta \sec^2\varphi}{(1 - \cos\theta + \sin\theta \tan\varphi)^2} \end{array} \right|$$
(6)

假定 s=200 mm, d=200 mm,  $\theta$ =1°,  $\varphi$ =40, 可以得 到 f=13 716.607 mm, 带入公式(5), 可以得到 c(s)= 0.015<<1, c(d)=0.985<1, c( $\theta$ )=0.995<1, c( $\varphi$ )=1.382> 1, s 的微小变化引起的误差很小, 而  $\varphi$  的微小变化 引起的误差最大, 而且测量的焦距越大, c( $\varphi$ )越大。 d,  $\theta$  的条件数都接近 1, 所以这两个值微小变化引起 的误差也比较大, d,  $\theta$ ,  $\varphi$  这三个参数要精确测量或 标定<sup>[6]</sup>。

其中莫尔条纹的角度 φ值可以通过软件得到精 确值,在此不做详细讨论。

假设测量焦距为 10 m 的透镜,考虑装调和使 用方便,待测系统与光栅距离设置为 s=100 mm,参 数 s 对测量结果影响很小,测量误差<10 mm,其造 成的焦距测量误差<0.01%,满足系统要求;图 4 为 不同光栅间距条件下系统测量误差随栅线夹角的 变化曲线,系统的测量误差随光栅间距的增大而减 小,当光栅间距 d=100 mm 时测量误差减小变缓且 已经包含足够的栅线夹角范围来满足系统测量精度 要求,由于光栅间距越大,系统结构越大,因此选择 d≈100 mm,装调完成后微调至整数个泰伯距处可 以得到清晰的条纹,当测量误差 Δd<0.1 mm,造成的 系统误差 Δd/d<0.1%,满足系统要求;根据图 4 中 d=



图 4 不同栅线夹角引起的误差

Fig.4. Error caused by different angle of two grating lines

**100 mm** 时的曲线图可以得到  $\theta$ =1.5°时系统误差最小,所以设置栅线夹角  $\theta$ =1.5°。

图 5 为栅线夹角 θ的标定精度不同引起的系统 误差,由图 5 可知当 θ的标定精度优于 0.002°时可 以使 θ 角造成的焦距测量误差<0.2%,满足测量系 统要求。



图 5 不同标定精度引起的误差



#### 3 系统的装调与标定

根据以上精度分析,采用五棱镜扫描法检测波前 质量,保证出射波前 PV 值优于 λ;采用光栅尺位移传 感器标定两光栅的间距 d,标定精度优于 0.1 mm;采 用标准反射凹球面法标定栅线夹角 θ,使光栅夹角 的标定精度达到 0.001。

#### 3.1 准直波前发生器的装调

装调过程中采用五棱镜扫描法对波前质量进行 检测,理想五棱镜有一个光学特性,光线在五棱镜主 截面内的转向角度只与两反射面的夹角有关,即使 入射光线与入射面并非严格垂直,其出射光线亦可 精确垂直转向。采用一个质量较好的五棱镜和直线 度高的导轨,将被测区域划分成有限个子孔径,利用 一个小口径的五棱镜依次地测量并计算出各子孔径 的光斑质心,得到各子孔径的质心偏移后就可以计 算出波面上各采样点的斜率,而这些斜率值就是待 测波面在采样点的一阶导数值,再通过一重积分,就 可求得待测波面。检测波前的简图如图 6 所示。

如果波面很理想,则平行光束经过五棱镜后,偏转 90°仍然以平行状态出射,在导轨末端处放置凸透镜,平行光束通过透镜后就会聚焦到该透镜的像方焦点上,在透镜像方焦点处放置 CCD 采集图像,能够得到一个明亮的光斑。然而若出射波面的各点波矢量是杂乱无章的,则经过五棱镜转向后出射的

光束的各点波矢量仍然是杂乱的,则波面经过透镜 后,各光束便不能都聚焦到像方焦点处,通过 CCD 就能够观察到光斑随着五棱镜在导轨上的滑动而在 视场中移动,用 CCD 记录五棱镜在导轨上每个采样 点的光斑图像,通过程序处理计算出各采样光斑的 质心位置,再由各质心位置得到波面各点的径向斜 率,通过斜率多项式拟合出被测波面的斜率系数,由 斜率系数可以重构出被测波面<sup>[7-8]</sup>。



文中系统以口径为 φ200 mm 的波面作为测试对 象,选择尺寸边长为 8 mm 的五棱镜,精度为 1 mm, 长度为 300 mm,平直度很好的导轨,CCD 和成像物 镜。实验得到的被测波面如图 7 所示,PV 值为 0.609λ<λ,满足系统要求。



#### 3.2 泰伯干涉仪的标定

泰伯干涉系统是整个测量系统的核心部分,其 中包括两片 Ronchi 光栅和接收屏。

泰伯干涉仪的标定包括光栅间距 d 和栅线夹角 θ的标定。

3.2.1 光栅间距标定

两光栅的间距标定采用光栅尺进行标定,标定 精度优于 0.1 mm。 3.2.2 栅线夹角的标定

栅线夹角 θ 对焦距的测量精度影响很大,为了 提高焦距测量精度,必须对 θ进行精确标定。

采用焦距 f=2 015 mm 标准反射凹球面法标定  $\theta$ ,其原理为利用测量和计算得到的 s、d、 $\varphi$  值以及精 确测量的焦距=2015 mm 的标准反射凹球面,根据 公式(1)计算出  $\theta$ ,装调测试光路如图 8 所示,包括 准直波前发生器、标准反射凹球面、平面反射镜、泰 伯干涉仪和成像采集系统。准直波前发生器发射出 平行光,经标准反射凹球面和平面反射镜反射至 泰伯干涉仪,在接收屏上形成莫尔条纹,由成像采 集系统采集。在 $\theta$ 角标定过程中,采集莫尔条纹并 利用傅里叶变换法求出莫尔条纹的角度  $\varphi_{\circ}$ 而标准 反射凹球面的焦距可采用 Taylor Hobson 的轮廓仪 精确测量,因此利用已知的焦距值可以计算出当 前状态的栅线夹角  $\theta_{\circ}$  通过多次调整和计算  $\theta_{\circ}$ 使 其调整到1.5°。由于轮廓仪的焦距测量精度可达 到 0.1%, 根据公式(1)可以得到  $\theta$ 的标定精度可优 于 0.001,满足系统要求。



图 8 栅线夹角标定

Fig.8 Angle calibration of two grating lines

具体标定方法:装调完毕系统正常工作以后, 开始采集条纹,通过傅里叶变换得到莫尔条纹频 谱图,根据频谱图求出莫尔条纹偏转角度 φ;测量 标准反射凹球面到平面反射镜之间的距离,记为 s1,平面反射镜到 G1 的距离,记为 s2, s=s1+s2;测 量 G1、G2 之间的距离 d;而标准反射凹球面的焦 距值 f=2 015 mm是已知的,把 s、d、φ、f 带入公式(1) 计算出光栅的夹角θ,此时标定完成。

### 4 实验与结论

实验中对已经精确标定的焦距为 5 436 mm 的 单透镜进行测量。其中参数测量及标定值为:d= 100 mm,s=100 mm, $\theta$ =1.5°。

实验装置如图9所示。



图 9 实验装置 Fig.9 Experimental device

实验采集到的条纹与对应的傅里叶变换如图 10~ 图 13 所示。



图 10 放入透镜前的条纹 Fig.10 Moiré fringe before placing in lens



图 11 傅里叶变换频谱图

Fig.11 Fourier transform spectrogram



图 12 放入透镜后的条纹 Fig.12 Moiré fringe after placing in lens



图 13 傅里叶变换频谱图 Fig.13 Fourier transform spectrogram

如表1所示,多次测量取平均值得到待测透镜的 焦距值为5416.75mm,而实际焦距值为5436mm,误 差为0.35%。

#### 表1每次测量的待测透镜焦距值

#### Tab.1 Corresponding focal lengths of

each measurement

Serial number	Angle of Moiré fringes $\varphi(^{\circ})$	Focal lengths of samples
1	35.10	5 436.14
2	35.22	5 412.88
3	35.15	5 426.43
4	35.25	5 407.09
5	35.35	5 387.84
6	35.20	5 416.75
7	35.30	5 397.46
8	35.05	5 445.87
Average value	35.20	5 416.75

文中提出了了基于泰伯莫尔效应的长焦距测量系 统的装调方法,用数值分析的方法详细分析了待测样 品到光栅 G1 的距离 s、光栅 G1、G2 的距离 d、栅线夹 角 θ对焦距测量精度的影响,并在此基础上提出了具 体的装调方法,可以使测量系统达到以下技术要求:准 直波前质量 PV 值优于一个波长;s 的测量精度和 d 的 标定精度达到 0.1mm,的标定精度达到 0.001°。实验中 测量焦距 5436mm 的透镜,误差为 0.35%。

#### 参考文献:

[1] Yuan Shidong. The measurement of large aperture and

long focal length mirrors [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2008.

袁士东.大口径长焦距反射镜焦距测量技术 [D]. 哈尔 滨:哈尔滨工业大学, 2008.

[2] Hou changlun. A method for mesuremnet of long focal length based on Talbot effect [D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2005.

侯昌伦. 基于 Talbot 效应的长焦距测量系统的研究[D]. 杭州:浙江大学, 2005.

[3] Wu Lingling, Wang xing, Chen Jing, et al. Limit precision analysis of focal length measurement of lens based on Talbot-moire effect[J]. Applied Optics, 2011, 32(4): 693-697. (in Chinese)

吴玲玲, 王星, 陈靖, 等. 基于 Talbot-Moiré 法的长焦透镜焦距 测量的极限精度分析[J].应用光学 2011, 32(4): 693-697.

[4] Yun Yu, Xie Ping, Peng Yong, et al. Method for testing light colimination based on Talbot effect [J]. Infrared and Laser Engineering, 2008, 37: 267-269. 云宇, 解平, 彭勇, 等. 基于 Talbot 效应检测光束准直性

方法的研究[J]. 红外与激光工程, 2008, 37: 267-269.

- [5] Wang Mingjia, Wu Zhiguo, Xu Dapeng, et al. Accurate and automatic recognition of Moiré fringe angle [J]. China Optics, 2011, 4(5): 509-512.
  王明佳,武治国,徐大鹏,等.精确自动识别莫尔条纹方向角的算法[J]. 中国光学, 2011, 4(5), 509-512.
- [6] Jin Xiongrong, Zhang Jinchun, Bai Jian. Calibration method for high - accuracy measurement of long focal length with Talbot interferometry [J]. Appied Optics, 2012, 51 (13): 2407-2413.
- [7] Wu Xuhua, Chen Lei, Xiao Shaorong. Wavefront testing of collimation beam in phase shifting interferometer [J]. Infrared and Laser Engineering, 2008, 37(1): 106-11. 武旭华,陈磊,肖韶荣. 干涉仪准直系统波前质量检测 [J]. 红外与激光工程, 2008, 37(1): 106-110.
- [8] Liu Zhaodong, Yu Lina, Han Zhigang, et al. Mesurement of the wavefront of collimation of a large aperture near – infrared interferometer using a scanning penteprism system
   [J]. Chinese Journal of Lasers, 2010, 37(4): 1082-1087. (in Chinese)

刘兆栋,于丽娜,韩志刚,等.五棱镜扫描法检测大口径 近红外干涉仪准直波前 [J].中国激光,2010,37(4): 1082-1087.